

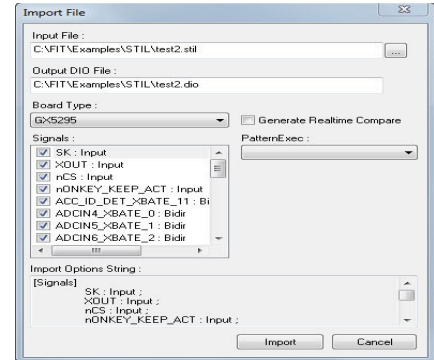
MARVIN TEST SOLUTIONS

DIOEasy-FIT

STIL、WGL、VCD/EVCD ベクタのインポートおよび変換を行うファイル・インポート・ツール

FILE IMPORT TOOL FOR IMPORTING AND CONVERTING STIL, WGL, VCD/EVCD VECTORS

- STIL デジタルベクタ (IEEE-1450、Standard Test Interface Language ファイル) を MTS デジタルベクタ形式にインポート・変換
- WGL デジタルベクタ (TSSI Waveform Generation Language ファイル) を MTS デジタルベクタ形式にインポート・変換
- VCD/EVCD デジタルベクタ (IEEE-1364、Value Change Dump ファイル) を MTS デジタルベクタ形式にインポート・変換
- Marvin Test Solutions の GX529x および GX5055 PXI デジタル計測器に対応
- ピン・リマッピングによりピン割り当ておよび無視 (ignore) 機能をサポート
- プロファイル定義によりインポート設定を保存でき、複数回・反復的なファイルのインポート／変換を簡素化
- DIOEasy と組み合わせて動作するアドオン・ライセンス・オプション



概要 (DESCRIPTION)

Marvin Test Solutions の DIOEasy-FIT オプションは、STIL、WGL、VCD/EVCD ファイルを Marvin Test Solutions のデジタル計測器ファイル形式にインポート・変換するためのソフトウェア・ツールセットをテストエンジニアに提供します。DIOEasy-FIT は、MTS の全ダイナミック・デジタル計測器向けにデジタル・テストベクタの開発、デバッグ、実行を効率的に行える Marvin Test Solutions の波形表示・編集ソフトウェア DIOEasy と組み合わせて動作します。

Standard Test Interface Language (STIL、IEEE-1450) は、複数のテスト機器ベンダ、CAE (コンピュータ支援エンジニアリング)、CAD (コンピュータ支援設計)、IC ベンダからなるコンソーシアムによって開発されました。本標準は、デジタル・テストデータ・ベクタを設計環境からテスト環境へ受け渡すための共通言語を提供します。

Waveform Generation Language (WGL、「ウィグル」と発音) は、Test System Strategies Inc. (TSSI) が策定したデータ記述言語です。WGL ファイルは基本的にテキストファイルであり、信号パターンとタイミング、診断、その他の情報を含みます。WGL ベクタ形式は、製品開発における設計検証および量産テストの各段階で半導体デバイスをテストするために広く使用されています。これらのベクタは EDA (電子設計自動化) ツールによって生成され、デバイスをテストして物理実装がシミュレーション結果と一致することを検証するために使用されます。

VCD および EVCD ファイル形式は、IEEE-1364 (IEEE Standard for Verilog® Hardware Description Language) の一部です。Extended VCD (EVCD、IEEE-1364-2001) は VCD ファイル形式の新しいバージョンで、方向性をもつデータをサポートします。

DIOEasy-FIT と GTDIO ライブラリは、上記ファイルをインポートして DIO ファイル形式に変換する機能を提供し、変換後のファイルは DIO カードにロードできます。ファイルのインポート時に、デジタル計測器のステップレートに対応するクロックレートを指定できます (例えば既定値の 10 ns (100 MHz) は GX5292 ボードの最速クロックレートです)。指定したクロックレートが遅すぎて、インポートしたファイルで定義されたタイミング制約 (例: クロック > UUT 出力プロベリング・ウィンドウ など) を満たせない場合はエラーが返されます。生成される DIO ファイルは、stimulus / response モードとリアルタイム比較 (RTC) モードの両方に対応します。

アプリケーション (APPLICATIONS)

- 半導体テストシステム
- デジタル・テストシステム
- ミックスドシグナル・テスタ
- デジタル・エミュレーション・システム
- ハイブリッドおよび SoC 部品の試験

仕様 (SPECIFICATIONS)

DIOEasy 用ファイル・インポート・ツール オプションの機能 (DIOEASY-FIT - FILE IMPORT TOOL OPTION FOR DIOEASY - FEATURES)	
対応ファイル形式 (Supported File Formats)	STIL デジタルベクタ (IEEE-1450、Standard Test Interface Language ファイル) WGL デジタルベクタ (TSSI Waveform Generation Language ファイル) VCD/EVCD デジタルベクタ (IEEE-1364-2001、Value Change Dump ファイル)
対応デジタル・テストハードウェア (Supported Digital Test Hardware)	GX5055、6U PXI、32 チャンネル・デジタル計測器 GX529x、3U PXI、32 チャンネル・デジタル計測器
対応デジタル・チャンネル幅 (Supported Digital Channel Width)	最大 512 チャンネル (ハードウェア構成に依存)
デジタル・ベクタ深さ (Digital Vector Depth)	最大 64 Mb/チャンネル (ハードウェア構成に依存)

対応デジタル計測器 (COMPATIBLE DIGITAL INSTRUMENTS)	
GX529x シリーズ (GX529x Series)	GX5292: 3U PXI、100 MHz、32 チャンネル・ダイナミック・デジタル計測器。チャンネルごと・ベクタごとのドライブ/センス制御。 GX5293: 3U PXI、200 MHz、16 チャンネル・ダイナミック・デジタル計測器。チャンネルごと・ベクタごとのドライブ/センス制御。 GX5295: 3U PXI、100 MHz、32 チャンネル・ダイナミック・デジタル計測器。プログラマブル・ピンエレクトロニクスとピンごとの PMU を搭載。
GX5055	6U PXI、50 MHz、32 チャンネル・ダイナミック・デジタル計測器。チャンネルごと、-10~+15 V のプログラマブル・ドライバ/センサ。

注: 仕様は予告なく変更される場合があります。

オーダー情報 (ORDERING INFORMATION)

本体 (DIOEasy-FIT)	
DIOEasy-FIT	DIOEasy ファイル・インポート・ツールキット。STIL、WGL、VCD/EVCD ファイルを GX529x および GX5055 デジタル I/O カード用の Marvin Test Solutions デジタル・ファイル形式に変換します
DIOEasy-FIT-UG	DIOEasy ファイル・インポート・ツールキットのアップグレード
DIOEasy-FIT-S1Y	DIOEasy-FIT のサブスクリプション/サポート更新 1 年 (継続契約が必要)
DIOEasy-FIT-S2Y	DIOEasy-FIT のサブスクリプション/サポート更新 2 年 (継続契約が必要)
DIOEasy-FIT-S3Y	DIOEasy-FIT のサブスクリプション/サポート更新 3 年 (継続契約が必要)
DIOEasy-FIT-EXP6	期限切れ DIOEasy-FIT サブスクリプション/サポートの 1 年更新 (期限切れ 1 日~6 か月)
DIOEasy-FIT-EXP24	期限切れ DIOEasy-FIT サブスクリプション/サポートの 1 年更新 (期限切れ 7~24 か月)
DIOEasy-FIT-SUP	DIOEasy-FIT の 1 年サポートのみ (アップグレードなし)

トレーニング (TRAINING)	
DIOEasy-DS	Marvin Test Solutions (Irvine, CA) での 2 日間の DIOEasy トレーニング、1~3

トレーニング (TRAINING)

	名。大人数の場合はお問い合わせください。
DIOEasy-DS2	オンサイトでの 2 日間の DIOEasy トレーニング・セミナー、1～3 名。大人数の場合はお問い合わせください。

ソフトウェア (SOFTWARE)

DIOEasy	デジタル I/O ベクタ開発ソフトウェア
----------------	----------------------

お問い合わせ (CONTACT)

本製品に関するご質問、お見積り、デモンストレーションのご依頼は、下記までお気軽にご連絡ください。

アンドールシステムサポート株式会社 (ANDOR SYSTEM SUPPORT CO., LTD.)

部署	自動テストソリューション事業部
所在地	〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町 66-2 興和川崎西口ビル 8 階
TEL	044-201-7844（代表）
E-mail	marvintest@andor.jp
Web	https://www.andor.jp/
お問い合わせ	https://www.andor.jp/company/contact/

本書は Marvin Test Solutions, Inc. の英文データシート（Revision B • Updated May 20, 2026）を日本語に翻訳した参考資料です。仕様は予告なく変更される場合があります。正式な仕様は英文原本を参照してください。

Copyright © Marvin Test Solutions, Inc. All rights reserved. 記載の製品名および社名は各社の商標です。